

中华人民共和国国家标准

GB/T 29310—2012/IEC 62539:2007

附录 B
(资料性附录)
参考文献

- [B1] Abernethy, R. B. The New Weibull Handbook (2nd edition). published by the author, 1996.
- [B2] Cochran, W. G. and Snedecor, G. W. Statistical Methods. Iowa State, 1976, 6th ed.
- [B3] Dissado, L. A. and Fothergill, J. C. Electrical Degradation and Breakdown in Polymers. Peter Peregrinus for the IEE, 1992.
- [B4] Dixon, W. J. and Massey, F. J. Introduction to statistical analysis. McGraw-Hill, 1957.
- [B5] Fischer, P in. Electrical properties of polymers (ed. Seanor, D. A.). Academic Press, 1982, Chap. 8, pp. 319-367.
- [B6] Fulton, W and Abernethy, R. B. A simple method for comparing designs. Are data sets significantly different?. SAE Weibull User's Conference, March 1995.
- [B7] Lawless, J. F. and Stone, G. C. Some graphical techniques for estimating Weibull confidence intervals. IEEE Transactions on Reliability, R-33, pp. 362, Dec. 1984.
- [B8] Lawless, J. F. Statistical Models and Methods for Lifetime Data. New York: John Wiley and Sons, 1982.
- [B9] Montanari, G. C., Mazzanti, G., Cacciari, J. and Fothergill, J. C.. In search of convenient techniques for reducing bias in the estimation of Weibull parameters for uncensored tests. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 4(3), pp. 306-313, 1997.
- [B10] Montanari, G. C., Mazzanti, G., Cacciari, J. and Fothergill, J. C.. Optimum estimator for the Weibull distribution of censored data: singly-censored tests. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 4(4), pp. 462-469, 1997.
- [B11] Montanari, G. C., Mazzanti, G., Cacciari, J. and Fothergill, J. C.. Optimum estimator for the Weibull distribution of censored data: progressively-censored tests. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 5(2), pp. 157-164, 1998.
- [B12] Natrella, M. G. Experimental Statistics. NBS Handbook, 91, 1966, pp. 2-14.
- [B13] Nelson, W. Applied Life Data Analysis. Wiley, 1982, ISBN 0-471-09458-7.
- [B14] Ross, R. Graphical methods for plotting and evaluating Weibull distributed data. Proceedings of the IEEE International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, 1, pp. 250-253, 1994.
- [B15] Schmee, J., Gladstein, D. and Nelson, W. Confidence limits for parameters of a normal distribution from singly censored samples, using maximum likelihood. Technometrics, 27(2), pp. 119-128, May 1985.
- [B16] White, J. S.. The Moments of Log-Weibull Order Statistics. Technometrics, 11(2), pp. 373-386, 1969.

GB/T 29310—2012/IEC 62539 :2007

电气绝缘击穿数据统计分析导则

Guide for the statistical analysis of electrical insulation breakdown data

(IEC 62539:2007, IDT)



GB/T 29310-2012

版权专有 侵权必究

*
书号: 155066 · 1-46694
定价: 36.00 元

2012-12-31 发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

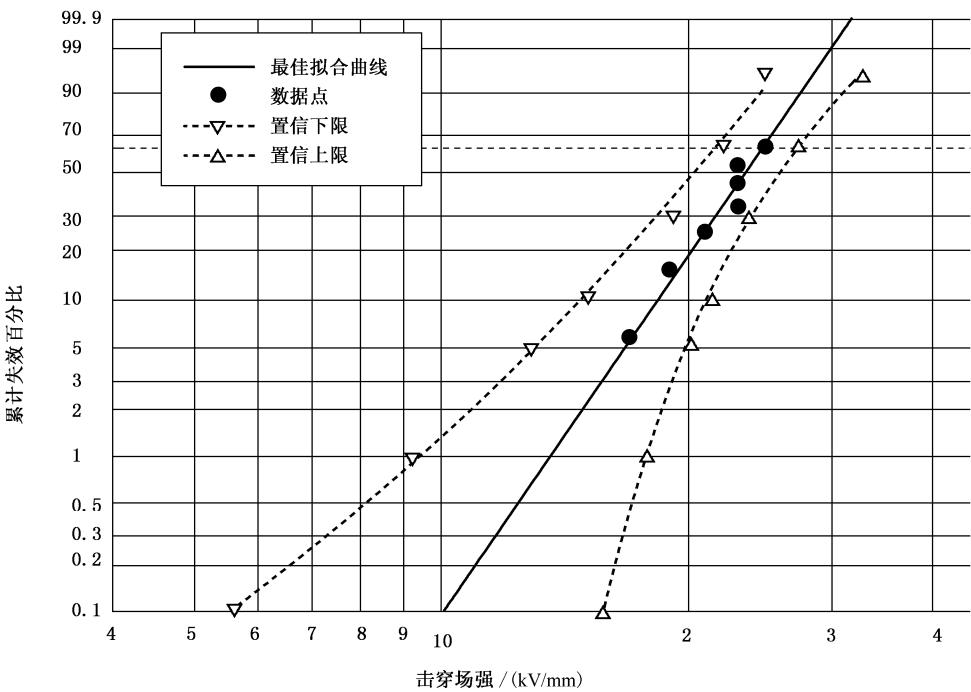


图 A.30 图 A.12 中数据的置信区间的 Weibull 分布

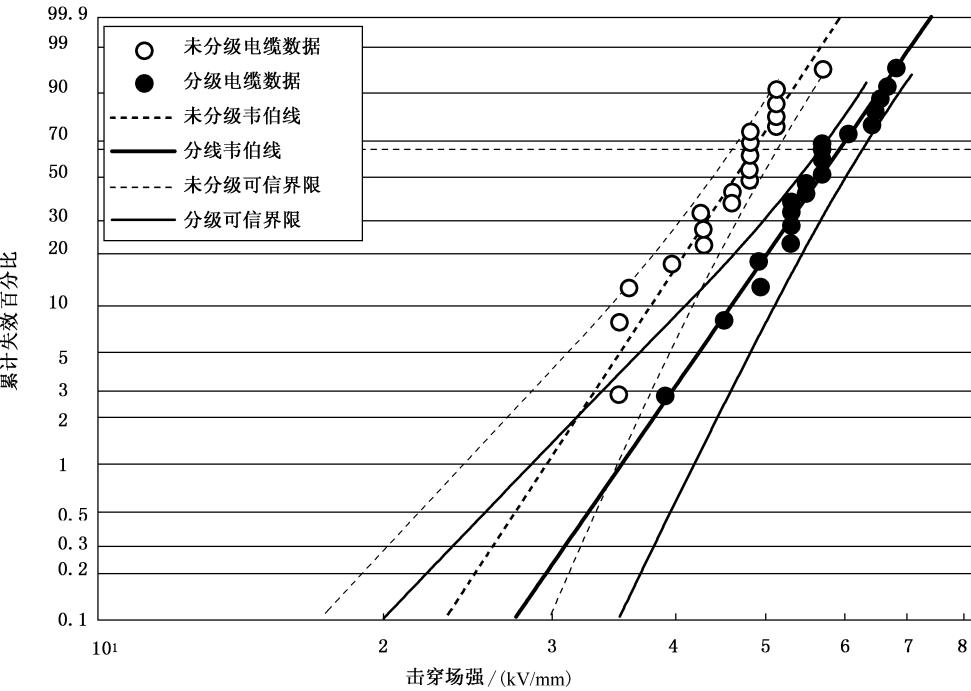
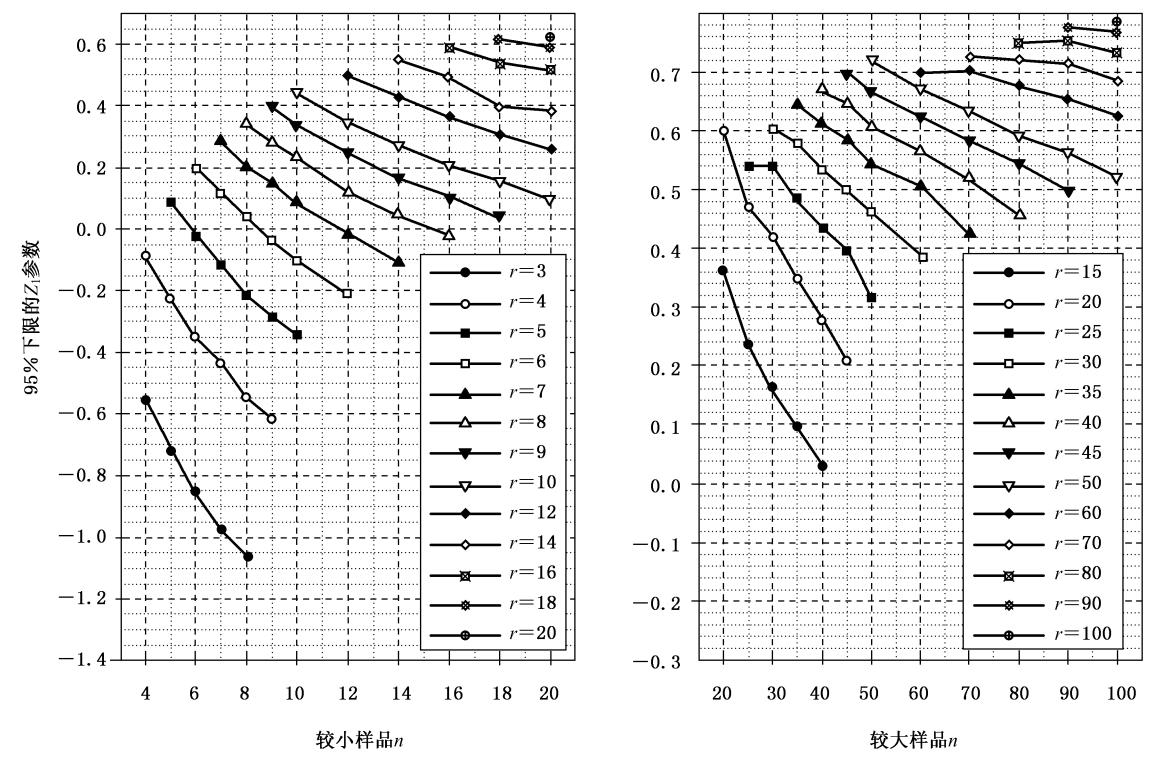
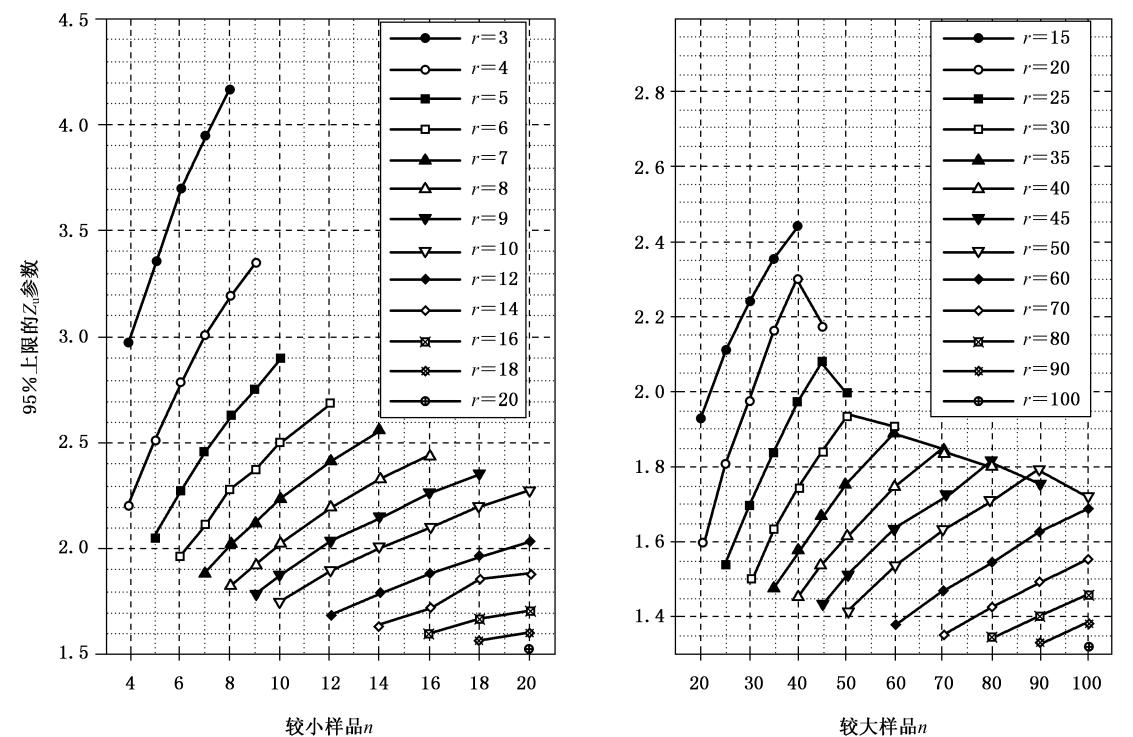


图 A.31 对屏蔽和非屏蔽电缆数据的比较

中华人民共和国
国家标准
电气绝缘击穿数据统计分析导则
GB/T 29310—2012/IEC 62539:2007
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 2.5 字数 70 千字
2013年5月第一版 2013年5月第一次印刷
*
书号: 155066·1-46694 定价 36.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

图 A.28 计算 95%,90% 置信下限 Z_l 因子图 A.29 计算 95%,90% 置信上限 Z_u 因子

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 击穿数据分析所需要的步骤	1
3.1 数据采集	1
3.1.1 常用的测试技术	1
3.1.2 其他数据	2
3.1.3 数据要求	2
3.1.4 数据采集过程中的实际预防措施	2
3.2 运用概率函数表征数据	2
3.2.1 失效分布的类型	2
3.2.2 分布的充分性检验	3
3.2.3 参数估计和置信区间	3
3.3 假设实验	3
4 击穿数据的概率分布	3
4.1 Weibull 分布	3
4.2 Gumbel 分布	4
4.3 对数正态分布	4
4.4 混合分布	5
4.5 其他术语	5
5 分布的充分性检验	5
5.1 Weibull 概率数据	5
5.1.1 估计完整数据的绘点位置	5
5.1.2 估计单独截尾数据的绘点位置	5
5.1.3 估计逐步截尾数据的绘点位置	6
5.2 对三参数 Weibull 分布使用概率图	6
5.3 Weibull 概率图上分布的曲线形状	6
5.4 测试 Weibull 分布充分性的一个简单技术	6
6 Weibull 分布参数的图形估计	7
7 Weibull 参数估计的计算方法	7
7.1 较大的数据库	7
7.2 较小的数据库	8
8 Weibull 百分数的估计	8
9 Weibull 函数置信区间的估计	9
9.1 完整与截尾数据的图形方法	9